AFM による電気特性評価の最前線 株式会社日立ハイテク CT ソリューション開発部 相蘇亨

1. はじめに

原子間力顕微鏡(AFM)は、サブナノメートルオーダ ーの形状計測と同時に、電磁気特性や機械特性などの 様々な物性測定が可能な顕微鏡である。微細化する先 端デバイスや高機能化する先端材料が有する局所電気 物性を、より容易に可視化し、より正確にデータを解釈し たいとの要望に対応するため、当社製品である走査電 子顕微鏡(SEM)と、AFM100シリーズ(図1)をはじめとす る様々なAFMラインナップに対応した、同一箇所を測定 するための相関解析ソリューション(**SÆMic.**~セイミッ ク~)を提供してきた。本稿では電気物性測定のアプリ ケーション事例を中心に紹介する。



図 1. AFM100 シリーズの装置外観(上段: AFM100 Pro, 中段: AFM100 Plus, 下段: AFM100)

2. AFM による電気特性評価事例

2.1 積層セラミックコンデンサ断面の高精度電位 計測

積層セラミックコンデンサ(MLCC)の小型化、大容量 化に伴い薄層化と多層化が進んでおり、品質と性能を向 上させるため、誘電体層の電位勾配の可視化が求めら れている。探針-試料間の静電気力を検出して試料表面 の電位分布をナノスケールで計測するケルビンプローブ フォース顕微鏡(KFM)は非常に有用なツールであり、探 針近傍に働く静電気力を選択的に検出する周波数変調 型 KFM(FM-KFM)は、カンチレバー全体が感じる静電 気力を検出する振幅変調型 KFM(AM-KFM)に比べて 高い電位空間分解能と電位定量性を有する¹⁾。そこで、 およそ 2.5 µm 間隔で電極層が並ぶ MLCC の機械研磨 断面に、図 2(e)に示すように外部から電圧を印加し、 AM-KFM と FM-KFM のそれぞれで電位分布を計測し たところ、5 V が印加されている隣接電極間において、 FM-KFM では精度よく 5 V の電位差が計測された(図 2(c)(d))。一方、AM-KFM では 3.7 V と実際よりも小さい 電位差が計測された(図 2(a)(b))。 AM-KFM は電極面 積がカンチレバーに対して十分広ければ高精度に電位 計測できるが、今回のように電極が比較的狭い場合は、 両電極から発生する静電気力がカンチレバーに同時に 影響を及ぼし、電位値が平均化されて実際よりも小さく 計測される。



図 2.+5 V 印加時 MLCC 断面の AM-KFM/FM-KFM 比較

(a) AM-KFM 電位像
(b) AM-KFM 電位プロファイル
(c) FM-KFM 電位像
(d) FM-KFM 電位プロファイル
(e) 外部電圧印加 KFM のブロック図

2.2 リチウムイオン電池(LIB)負極の劣化メカニ ズム解析

LIB の高性能化、長寿命化には充放電サイクル試験に よる劣化要因の分析等が欠かせない。ここでは SiOx を 混合した黒鉛系の負極について、AFM 電気特性評価モ ードの 1 つである走査型拡がり抵抗顕微鏡(SSRM)と SEM-EDX による、サイクル試験前及び、常温サイクル後、 高温サイクル後の元素分布と電気抵抗分布の相関解析 結果を図 3 に示す²⁾。ここでは、AFM5300E とイオンミリ ング-SEM-AFM 共用可能な雰囲気遮断ミリングホルダ を用いて、試料作製から装置間の搬送を大気非暴露の 状態で実施した。充放電サイクル前の SSRM 像は、黒鉛 系活物質の境界付近が比較的低抵抗であるのに対し、 常温サイクル後および高温サイクル後 SSRM 像では、活 物質の境界が明るく観察されており、この領域が高抵抗 化していることがわかる。サイクル試験後に黒鉛系活物 質と、特にSi系活物質の境界に濃化しているフッ素の存 在から、この領域は SEI (Solid Electrolyte Interface) と考 えられ、その領域で電気抵抗が大きくなったものと推測 される。SSRM は 10^{4~10} Ωの広い範囲の抵抗分布を一度 の走査で確認できる特長を有する。このように、LIB の内 部抵抗増大の一因を、SEM-EDX とSSRM との相関解析 によって調べることができる。



図 3. 充放電サイクル前後のリチウムイオン電池負極の ミリング断面 SSRM/SEM/EDX 測定結果

2.3 低ノイズ光てこ検出系による高感度物性計測

現在、優れた圧電特性を示すチタン酸ジルコン酸鉛 (PZT)が電子機器や自動車に使用されているが、人体 や環境に優しい鉛フリー強誘電体への置き換えが求め られている。その中でもニオブ酸カリウムナトリウム(KNN) はPZTの代替材料として優れた圧電特性を有することが 知られている。その局所的な圧電特性を評価するために、 圧電応答顕微鏡(PRM)が広く用いられるが、デバイスの 微細化や薄膜化に伴い、微小な圧電変位の高感度検 出が求められている。そこで、高出力の高周波変調レー ザーを有する AFM100 Proと、スーパールミネッセントダ イオード(SLD)を有する AFM100 Plus を用いて、多結晶 KNN の同一箇所における PRM 信号(±10 V, 5 kHz 印 可時)を比較し、高感度光てこ検出系の物性測定への寄 与を評価した³³。図 4 に示すように、AFM100 Plus と AFM100 Pro の PRM 信号を比較すると、AFM100 Pro の 方が S/N 比が向上しており、バックグラウンドノイズ低減 が寄与していると思われる。その根拠として、AFM100 Plus の熱振動スペクトラム(図 5(a))と、AFM100 Pro の 熱振動スペクトラム(図 5(b))を比較すると、図中の赤い 矢印が示す通り、明らかにバックグラウンドノイズが低減 されており、光てこ検出系の低ノイズ化が物性計測に大 きく寄与することが明らかとなった。





図 5. SI-DF3P2 カンチレバーの熱振動スペクトラム比較 (a) AFM100 Plus (b) AFM100 Pro

参考文献

- 日立ハイテク会員制サイト S.I.navi, アプリケーションデータ シート HTD-AFM-047「FM-KFM による積層セラミックコン デンサ断面の低ノイズ・高精度電位計測」
- 日立ハイテク会員制サイト S.I.navi, アプリケーションデータ シート HTD-AFM-035「充放電サイクル前後のリチウムイオ ン電池負極のミリング断面 SSRM/SEM-EDX 相関分析」
- 3) 日立ハイテク会員制サイト S.I.navi, アプリケーションデータ シート HTD-AFM-046「圧電応答顕微鏡(PRM)における高 出力・高周波変調レーザーを用いた高感度検出」